

(1.85eV), 733nm (1.69eV), 812nm(1.52eV)의 세개의 피크로 분리되어 나타났으며, 피크분리는 포논에너지의 방출에 의한 것으로 격자진동에 의한 포논에너지의 방출에 의해 설명이 가능하였다.

**14-2-9)**  
**Ag 편광 광도핑에 의한 칼코게나이드 박막의 광유기 복굴절**  
 장선주, 박종화, 박정일, 정홍배

본 연구에서, 우리는 Ag 도핑된 칼코게나이드 박막의 이중층에서 Ag 편광광도핑에 의한 광유기 복굴절과 칼코게나이드 박막의 편광상태 의존성에 대해 연구했다. 또한 박막의 광에너지갭(Eop) 이하의 에너지를 갖는 두 개의 632.8nm He-Ne 레이저를 사용하여 비정질  $As_{40}Ge_{10}Se_{15}S_{35}$  칼코게나이드 박막에서의 흡수 이방성과 광유기 복굴절의 편광 의존성을 조사했다. Ag 편광광도핑의 광유기 현상은 약 84%의 선형이색성(D) 증가와 23%의 복굴절( $\Delta n$ ) 증가를 보였다. 이러한 결과는 칼코게나이드 박막의 광도핑 메카니즘과 분석에 많은 정보를 제공할 것이다.

**14-2-10)**  
**청색 발광 가용성 PPV 공중합체의 합성 및 특성**  
 이경민, 최병수

Wittig 반응에 의해 청색발광이 예상되는 가용성 PPV 공중합체를 합성하였고, 이들을 각종 분석장비들을 이용하여 분석한 다음 ITO/공중합체/Ca와 ITO/공중합체/Al의 구조를 가진 발광다이오드를 각각 제작하여 I-V 특성을 확인하였다.

UV-Vis./NIR 스펙트럼 측정 결과 공중합체들은  $\pi-\pi^*$  전이가 관찰되었으며, PL과 흡수 스펙트럼으로부터 공액 고분자의 분광학적 특성을 조사한 결과 비교적 뚜렷한 거울상 대칭 진동구조를 보이는 등 고분자상태보다는 분자 단위에서 나타내는 성질과 유사했으며, 특히 PPV보다는 구조의 정렬이 잘 되어있음을 확인할 수 있었다. 이러한 성질은 aliphatic hydrocarbon group의 도입에 의해 공중합체의 안정성이 증가된 결과로 보이며 치환기에 의한 영향은 그리 크지 않음을 알 수 있었다.

PL 측정결과 공중합체의 band offset이 약 3.0eV임을 알았으며, I-V특성 측정 결과 Ca 전극 사용시의 문턱전압

은 3V였고, Al 전극의 경우 12V를 나타내었다. 이는 Ca와 Al 전극의 일함수가 각각 2.9eV와 4.3eV 이므로 상대적인 에너지 장벽의 차이가 없는 Ca 전극을 사용시 전자와 정공사이의 균형이 잘 이루어져 반대전하들간의 재결합이 잘 일어나는 것으로 여겨진다.

**14-2-11)**  
**CeO<sub>2</sub>첨가와 도포물질의 입자크기가 확산공정을 이용한 고온초전도 후막의 특성에 미치는 영향**  
 임성훈, 강형근, 홍세은, 윤기웅, 황종선, 한병성

고온 초전도 박막 제조시 어려움을 극복하기 위해 후막 공정의 하나인 비교적 제조공정이 간단한 스크린 프린팅법을 이용 확산공정을 통해 고온초전도후막을 제작하였다. 도포물질로서  $YBa_2Cu_3O_x$  부분 용융물질의 일부성분 ( $3BaCuO_2 + CuO$ )을 택하였고 열처리를 통해 기판과 도포물질과의 확산을 이용하여  $YBa_2Cu_3O_x$  초전도체상을 형성시켰다.

1) 기판물질에  $CeO_2$  첨가량에 따른 형성되는 막의  $YBa_2Cu_3O_x$ 상조성비와 확산두께의 변화를 비교 관찰하였다. 기판에  $CeO_2$ 물질첨가는 액상도포물질과 기판과의 반응을 촉진하는 역할을 하며 이로 인해생성된 막의 두께가 점점 감소되는 사실을 알 수 있었다.

2)  $YBa_2Cu_3O_x$ 부분용융물질을 이용한 후막제작시 초기 액상도포물질의 입자크기가 확산을 통해 형성되는 상의 조성과 형성된 상의 크기와 두께에 주는 영향을 조사하였다. 초기액상도포물질의 입자크기가 감소함에 따라 전체적인 공극의 수가 줄어들음을 관찰할 수 있었고  $YBa_2Cu_3O_x$ 에 해당되는 피크가  $Y_2BaCuO_5$ 의 피크보다 커짐을 알 수 있으며 이는 부분용융을 이용한 확산과정동안 초기도포물질의 입자크기가 작을수록  $Y_2BaCuO_5$ 과 액상이 반응하여  $YBa_2Cu_3O_x$ 상이 형성되는 속도가  $Y_2BaCuO_5$ 과 액상의 분해속도보다 크기 때문으로 사료된다.

**14-2-12)**  
**새로운 ICP 장치를 이용한 고온 초전도체의 Dry Etching과 기존의 Wet Etching 기술과의 비교**  
 강형근, 임성훈, 임연호, 한윤봉, 황종선, 한병성

고온 초전도체의 미세 회로 제작에는 크게 습식식각(wet etching)과 건식 식각(dry etching)으로 나눌 수 있다. 화학용액을 이용하는 습식 식각은 반응속도가 용액 농도에 비례하고 크기가 큰 박막의 경우 기판 중심 부위